

NanoX-Pert „Sauberkeit der Oberfläche“

Termin: 16.04.2024
9:00 bis 16:30 Uhr

Ort: Physical Electronics GmbH
Salzstraße 8
85622 Feldkirchen bei München

Leitung: Stefan Reichmaier

Im Fokus:
Sauberkeit der Oberfläche
mit TOF-SIMS, XPS und Auger

PHI GmbH`s INHOUSE Seminare 2024:
Sharing X-Perience mit NanoX-Pert
NanoX-Pert (Oktober 2024)
Open Lab Day

Für das Seminar wird ein Unkostenbeitrag von 100,00 Euro zzgl. MwSt. erhoben. Darin enthalten sind Verpflegung, Informationsmaterial und ein Gutschein für eine Testmessung. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung und die Zahlung der Teilnahmegebühr erforderlich.

Die Vortragssprache ist Deutsch.

Bitte melden Sie sich [HIER](#) online an.



Registrierung bis spätestens 01.03.2024

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir Sie, sich rechtzeitig anzumelden.

Sie können leider nicht teilnehmen?
Informationen zu weiteren Terminen senden wir Ihnen gerne zu.

Bei Fragen zum Seminar steht Ihnen Frau Martin und Frau Weidner gerne zur Verfügung.

Monika Martin
lab@phi-europe.com

Nadine Weidner
nweidner@phi-europe.com

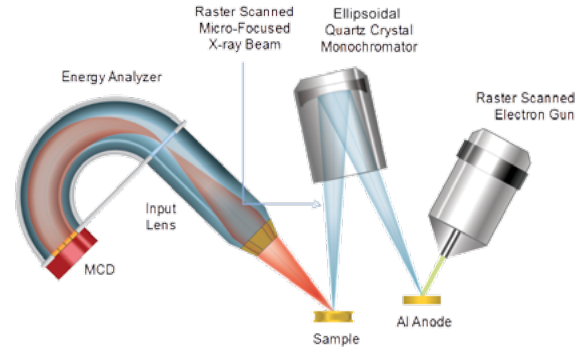
Die Agenda des Tages

- 09:00 Registrierung
- 09:15 Begrüßung und Einleitung
- 09:20 Anwendungsbeispiele:
Sauberkeit der Oberfläche
(TOF-SIMS, XPS, Auger)
- 10:30 **Oberflächenanalysen für
Silizium-Drift-Detektoren
Herr Dr. Höllt, KETEK GmbH**
- 11:00 Kaffeepause
- 11:15 Vorstellung der Methode TOF-SIMS
Vorstellung der Methode XPS
Vorstellung der Methode AES
- 12:45 Mittagessen (Buffet)
- 13:30 Praktischer Teil (3 Gruppen á 20 min)
TOF-SIMS; XPS; Auger und
Vertriebsthema Ihrer Wahl
- 15:00 Kaffeepause
- 15:15 **Die Messungen sind abgeschlossen:
Wie geht es weiter?** XPS-Datenauswertung
Zu viele Daten? Multivariate Statistik hilft!
PCA-Anwendungen mit TOF-SIMS Daten
- 16:00 Zusammenfassung:
Testmessungsgutschein & Feedback
- 16:15 Möglichkeit zur Diskussion Ihrer
individuellen Fragestellungen
- 16:30 Ende des Seminars

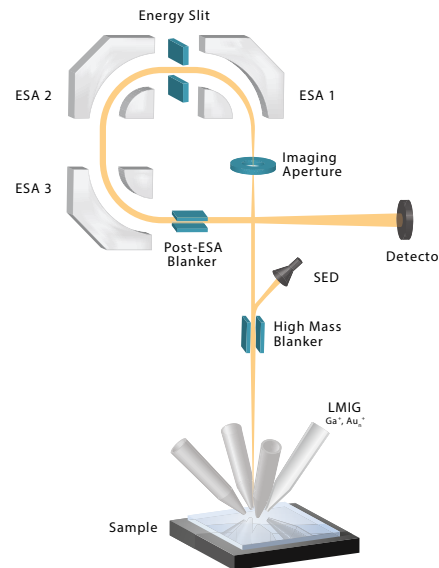
NEUER
GAST-
VORTRAG

Unter Vorbehalt eventueller Änderungen, diese werden rechtzeitig bekannt gegeben.

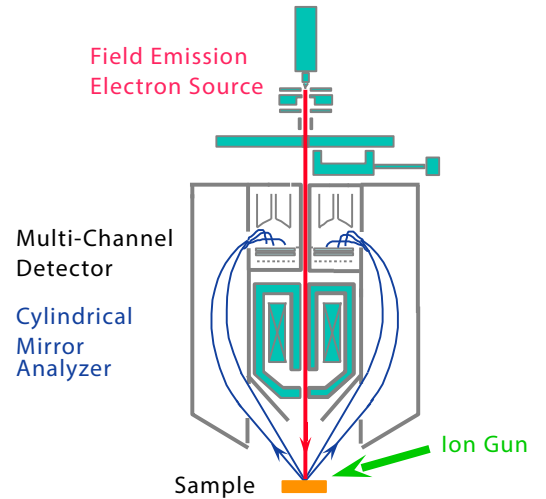
XPS (Röntgenphotoelektronenspektroskopie)



TOF-SIMS (Sekundärionenmassenspektrometrie)



AES (Augerelektronenspektroskopie)



Zielsetzung

Dieses Seminar gibt einen Überblick über die wichtigsten oberflächenanalytischen Methoden und vermittelt ein Verständnis für deren Anwendung.

Typische Fragestellungen

- Vergleich gute Probe – schlechte Probe
- Identifizierung der Oberflächenverunreinigung
- Quantifizierung der Oberflächenzusammensetzung

Im Seminar stellen wir Ihnen analytische Nachweisverfahren zur Untersuchung dünner Schichten oder zur Fehleranalyse und Qualitätskontrolle vor.

Freuen Sie sich auf die Darstellung der neuesten Geräteentwicklungen in der Oberflächenanalytik!

Unser Seminar, genau das Richtige für Sie.